

2025年度（上期）Chromaウェビナーのご案内

Theme of this time



次世代データセンター対応：OFC向け光デバイスの信頼性評価と先端温度制御ソリューション

本Webinarでは、AI・HPCから車載まで多様化・高度化する半導体市場の動向を踏まえ、Chromaが提供する最新のテストソリューションをご紹介します。AIの普及に伴い、データセンターにおけるデータ交換量と演算処理能力は飛躍的に増加しており、高速・低消費電力な通信技術への移行が進んでいます。これに対応する形で、Chromaはシリコンフォトニクス(SiPh)やCPO/Optical I/Oなどに対応した信頼性テストソリューションを展開し、特にレーザーダイオードの評価に注力しています。

また、AI・HPC用途の先端半導体や高性能車載半導体における温度制御ニーズにも対応すべく、熱強制ユニット「Cobra Series」を活用した最適なテスト環境をご提案します。

Cobraは低温から高温までの広範な温度条件における評価を可能にし、システムレベルテスト対応ハンドラとの連携によって柔軟かつ効率的な運用を実現します。具体的な応用事例を通じて、Chromaのトータルソリューションがもたらすテスト最適化のアプローチをわかりやすく解説します。

Point

- ・ AI時代の到来により、データセンターの高速処理・低消費電力化が急務
- ・ 光ファイバー通信技術とシリコンフォトニクス (SiPh) ・ EPICの導入が加速
- ・ 高発熱・広温度帯に対応した信頼性テストが重要に
- ・ 熱強制制御ユニット (Cobra) が、課題解決のカギ
- ・ システムレベルテスト (SLT) にも対応するChromaの包括的ソリューション

Presenter

【第一部】



クロマジャパン株式会社
半導体テストソリューション事業部
営業
山原 祥次 氏

【第二部】



クロマジャパン株式会社
半導体テストソリューション事業部
事業部長
大木 健史 氏

Overview



日 程 : 2025年6月26日(木) 15:00~16:00

配 信 : Zoomウェビナー

お申込 : 下記URLまたはQRコードからアクセス下さい

https://zoom.us/webinar/register/WN_HLVN0SEASzG8i8UGVw_Wjw

Organizer

東京電機産業株式会社
計測・通信営業部 パートナービジネス推進グループ

計測器及び弊社サービスの概要は下記URLでご確認下さい

https://www.tokyo-densan.co.jp/?page_id=8858

